

1 CV-Kurve.

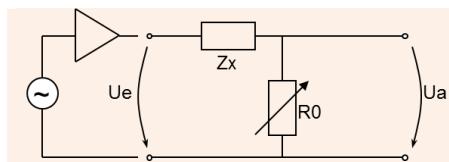
2 Großsignalverluste $\tan \delta$.

3 Permittivität in Abhängigkeit von Temperatur und Biasfeldstärke.

GROßSIGNAL-MESSPLATZ

Messprinzip, Messgrößen

Messung von Impedanz, Kapazität, Verlust bei hohen Signalspannungen.



Messung $U_a(t)$, $U_e(t)$, Berechnung von Z_x , Bestimmung von C_p aus $Im(Z)$

Größe	Wert
Signalspannung	AC: 1 V ... 4000 V
Offset	DC: 0 V ... 2000 V
Strom	0 mA ... 100 mA
Frequenz	0,1 kHz ... 2 kHz
Temperatur	RT ... 150 °C

Messunsicherheit C , Z : 1 %; $\tan \delta$: 5 %

Normen

MIL-STD-1376B, EN50324-3

Anforderungen an die Proben

- Abmessungen: keine Beschränkungen
- Kontaktierung: flächig oder bedrahtet

Leistungsangebot

Durchführungen von Messungen entsprechend Kundenwunsch

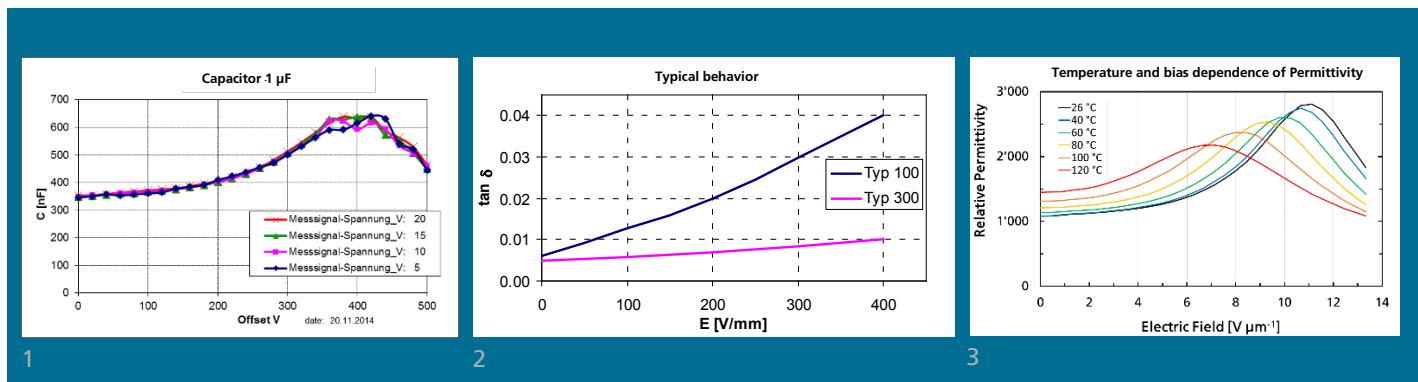
Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS

Winterbergstraße 28
01277 Dresden

Ansprechpartner
Dipl.-Ing. Uwe Keitel
Telefon 0351 2553 7727
uwe.keitel@ikts.fraunhofer.de

www.ikts.fraunhofer.de

Die maximale Messfrequenz hängt von der Probenkapazität, der Messspannung und der Leistungsfähigkeit des Verstärkers ab.



1 CV-curve.

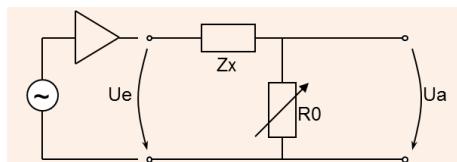
2 Loss factor under high signal voltage.

3 Permittivity depending on temperature and bias field.

LARGE SIGNAL MEASUREMENT

Principle of measurement

Measurement of impedance, capacity, loss factor by high signal voltage.



Parameter	Value
Voltage	AC: 1 V ... 4000 V DC: 0 V ... 2000 V
Current	0 ... 100 mA
Frequency	0.1 Hz ... 2 kHz
Temperature	RT ... 150 °C
Measurement uncertainty C, Z: 1 %; tan δ: 5 %	

Measurement parameters

Selectable parameters/measurement type:

- Signal voltage for small signal to large signal impedance,
- Variable offset voltage for CV measurement
- Wide frequency range
- Temperature dependency

Requirements for the samples

- Size: no restrictions
- Electrical contact: surface or leaded

Services offered

Measurements according to customer requirements

Fraunhofer Institute for Ceramic Technologies and Systems IKTS

Winterbergstrasse 28
01277 Dresden, Germany

Contact

Dipl.-Ing. Uwe Keitel
Phone +49 351 2553 7727
uwe.keitel@ikts.fraunhofer.de

www.ikts.fraunhofer.de

Measuring ranges

The maximum frequency of the measurement depends on the sample capacity and the performance of the amplifier.